Model AE-381A 超高速・高精確度・1MHz/1kHz/120Hz MLCC 用　容量量測儀

最適合 MLCC 晶片自動捆包機

特　徵

- ■超高速：0.3msec.[1MHz]、1msec.[1kHz]、8.34msc.[120Hz]（FAST 測量中時間）
- ■透過測量值異常檢知方式可於2點端子（4點端子）測量時檢出測量測針接觸不良情況
- ■4點端子接觸檢測
- ■測量頻率：1MHz / 1kHz / 120Hz±0.1%(正弦波)
- ■可 BIN 測量：C 14 分類及 Out of bin
- ■可切換 串聯等效電路、並列等效電路
- ■定電壓測量（無法對應部分檔位）
- ■可 DF 測量[0.0000 ～ 0.5000]、Q 測量[0 ～ 10000]
- ■C 測量：41/2 位數(15000)數位顯示、內建比較器功能可 HI / GO / LO 輸出
- ■RS-232C 介面、印表機輸出標準配備（符合 Centronics）（GP-IB 為選購）
- ■間歇性供給測量電流以減輕量測測針接觸之耗損
- ■即使於檢測中亦可輸出設定值、統計值、日期、時間至列表機



AEMIC株式会社

NEW !

Model AE-381A 超高速・高精確度・1MHz/1kHz/120Hz MLCC 用容量量測儀

SPECIFICATIONS TENTATIVE

測量範圍及基本精確度 （DF≦0.1 周圍溫度 23℃±5℃）

C 檔位	測量範圍	解析度	精確度[FAST 測量時則為下記精確度之 2 倍]			測量電壓[rms]
			1MHz	1kHz	120Hz	
1.5pF	0.0000pF～1.5000pF	0.0001pF	C:±1.0% of rdg±50dg 以內	———	———	1V±5%
		DF:0.0001	DF:±0.005±0.0001×(Cr/Cx)以內	———	———	0.5V±5%
15pF	0.000pF～15.000pF	0.001pF	C:±0.25% of rdg±25dg 以內	C:±0.25% of rdg±25dg 以內	———	1V±5%
		DF:0.0001	DF:±0.002±0.0005×(Cr/Cx)以內	DF:±0.002±0.00025×(Cr/Cx)以內	———	0.5V±5%
150pF	0.00pF～150.00pF	0.01pF	C:±0.15% of rdg±10dg 以內	C:±0.15% of rdg±10dg 以內	———	1V±5%
		DF:0.0001	DF:±0.001±0.0001×(Cr/Cx)以內	DF:±0.001±0.0001×(Cr/Cx)以內	———	0.5V±5%
1.5nF	0.0pF～1500.0pF	0.1pF	C:±0.15% of rdg±10dg 以內	C:±0.15% of rdg±10dg 以內	———	1V±5%
		DF:0.0001	DF:±0.001±0.0001×(Cr/Cx)以內	DF:±0.0005±0.0001×(Cr/Cx)以內	———	0.5V±5%
15nF	0.000nF～15.000nF	0.001nF	———	C:±0.15% of rdg±10dg 以內	———	1V±5%
		DF:0.0001	———	DF:±0.0005±0.0001×(Cr/Cx)以內	———	0.5V±5%
150nF	0.00nF～150.00nF	0.01nF	———	C:±0.15% of rdg±10dg 以內	———	1V±5%
		DF:0.0001	———	DF:±0.0005±0.0001×(Cr/Cx)以內	———	0.5V±5%
1.5μF	0.0nF～1500.0nF	0.1nF	———	C:±0.15% of rdg±10dg 以內	C:±0.15% of rdg±10dg 以內	1V±5%
		DF:0.0001	———	DF:±0.0005±0.0001×(Cr/Cx)以內	DF:±0.0005±0.0001×(Cr/Cx)以內	0.5V±5%
15μF	0.000μF～15.000μF	0.001μF	———	C:±0.3% of rdg±20dg 以內	C:±0.15% of rdg±10dg 以內	1V±5%
		DF:0.0001	———	DF:±0.001±0.0002×(Cr/Cx)以內	DF:±0.001±0.0002×(Cr/Cx)以內	0.5V±5%
150μF	0.00μF～150.00μF	0.01μF	———	C:±1% of rdg±50dg 以內	C:±0.5% of rdg±25dg 以內	1kHz：1V/0.5V ＋5%～-20%
		DF:0.0001	———	DF:±0.005±0.0005×(Cr/Cx)以內	DF:±0.003±0.0005×(Cr/Cx)以內	120Hz：0.5V±5%
1.5mF	0.0μF～1500.0μF	0.1μF	———	———	C:±1.5% of rdg±50dg 以內	120Hz/0.5V＋5%～－25%
		DF:0.0001	———	———	DF:±0.01±0.001×(Cr/Cx)以內	

※測量電壓為 0.5V 情況時上記精確度則為 2 倍

測量方式	5 點端子[3 點端子]測量方式
測量頻率	1MHz/1kHz/120Hz±0.1%、正弦波
測量訊號輸出抵抗	約 2Ω
雜散電容修正範圍	約 20pF
滿刻度及零度係數	±100ppm/℃以內
測量時間	【內部觸發周期】FAST：約 1～5 回/秒 SLOW：FAST×N(N:平均值設定次數) 【測量中訊號】FAST：0.3msec.[1MHz]、1msec.[1kHz]、8.34msec.[120Hz]、
測量範圍	Capacitance：0～15000 DF：0.0000～0.5000 Q：0～10000
BIN 測量	C:14 分類及 Out of bin
使用周圍環境	溫度：0℃～+50℃、 濕度：85%以下
所需電源	AC85V～265V、50～60Hz、約 50VA
外形尺寸	250(W)×99(H)×300(D)mm（不含底部橡膠部分）
重量	約 3.5kg

GP-IB 選購	

○型錄的規格會因機台改良而隨時變更。

AEMIC 株式会社

〒612-8448
京都市伏見區竹田東小屋ノ内町 34 番地
電話: +85-75-612-0710 FAX: +85-75-612-0750
E-Mail: sales@ae-mic.com
http://www.ae-mic.com